

**ТРАНЗИСТОРЫ ПОЛЕВЫЕ**

Метод измерения тока утечки затвора

Field-effect transistors

Gate leakage current measurement technique

**ГОСТ****20398.6—74\*****[СТ СЭВ 3413—81]**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31 декабря 1974 г. № 2852 срок введения установлен

с 01.07 76

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

до 01.07 86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на полевые транзисторы и устанавливает метод измерения тока утечки затвора  $I_{з.ут}$ \*. Общие условия при измерении тока утечки затвора должны соответствовать требованиям ГОСТ 20398.0—74.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3413—74 в части метода измерения тока утечки затвора (см. справочное приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**1. АППАРАТУРА**

1.1. Измерительные установки, предназначенные для измерения тока утечки затвора  $I_{з.ут}$ , должны обеспечивать основную погрешность измерения в пределах  $\pm 10\%$  от конечного значения рабочей части шкалы, если значение  $I_{з.ут}$  не менее 0,1 мкА, и в пределах  $\pm 15\%$  от конечного значения рабочей части шкалы, если значение  $I_{з.ут}$  менее 0,1 мкА.<sup>1</sup>

**2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ**

2.1. Принципиальная схема измерения тока утечки затвора  $I_{з.ут}$  должна соответствовать указанной на чертеже.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

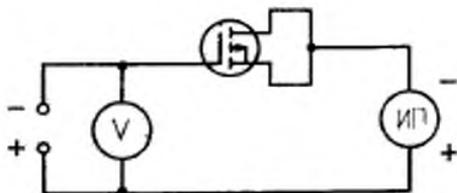
★

\* Переиздание март 1984 г. с Изменением № 1, утвержденным в июле 1983 г. (ИУС 11—83).

2.2. Основные элементы, входящие в схему, должны удовлетворять следующим требованиям, изложенным ниже.

2.2.1. Падение напряжения на внутреннем сопротивлении не должно превышать 5% от показаний измерителя  $V$ .

2.2.2. Если это условие не выполняется, необходимо увеличить напряжение источника на значение, равное падению напряжения на внутреннем сопротивлении  $ИП$ .



$V$ —измеритель напряжения;  $ИП$ —измеритель тока.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Измерения производят в следующем порядке.

Транзистор включают в схему и устанавливают напряжение на затворе, значение которого должно соответствовать указанному в стандартах или технических условиях на транзисторы отдельных типов.

Значение тока утечки  $I_{з,ут}$  отсчитывают по шкале  $ИП$ .

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 20398.6—74 СТ СЭВ 3413—81  
ГОСТ 20398.6—74 полностью соответствует разд. 3 СТ СЭВ 3413—81  
(Введено дополнительно, Изм. № 1).